

CT & Metrologie Anwendung der VDI/VDE Richtlinie 2630 und Optimierung des Systems

Alexander SUPPES *, Eberhard NEUSER *

* GE Sensing & Inspection Technologies GmbH, Niels-Bohr-Str. 7, 31515 Wunstorf eberhard.neuser@ge.com

Kurzfassung

Die Computer Tomographie hat sich zu einem etablierten industriellen Prüfverfahren entwickelt. Darüber hinaus finden Methoden Anwendung, die den Anwendungsbereich in die Messtechnik erweitern. Im Rahmen dieser Entwicklung wurde eine VDI/VDE Richtlinie erstellt, die beschreibt wie ein CT System für den Einsatz in der Metrologie qualifiziert werden kann.

Bei der Anwendung der VDI/VDE Richtlinie auf ein typisches CT System wurden zunächst geometrische Kenngrößen wie z.B. Längenmessabweichung und Antastabweichung ermittelt. Eine Untersuchung des Einflusses der wichtigen Systemkomponenten wie Röhre, Detektor oder Manipulator auf die Kenngrößen zeigt Optimierungspotential auf. Insbesondere die Korrektur von Detektor und Manipulationssystem sind interessant. Die Steigerung der messtechnischen Gesamtperformance des Systems wird final aufgezeigt.











VDI 2630, Blatt 1.3 - Zielsetzung Definition allgemeingültiger Kenngrößen Vergleichbarkeit von Spezifikationen Aufsetzen auf bestehenden Standards in der Koordinaten-messtechnik Akzeptanz bei Anwendern konventioneller Messtechnik KEINE Aussage zur Meßunsicherheit (kundenspezifische bauteilbezogene Kenngrößen) Copyright © 2014 General Electric Company Inspection Technologies 5





















